

2020年11月24日
一般財団法人日本規格協会

JIS 見直しの審議について

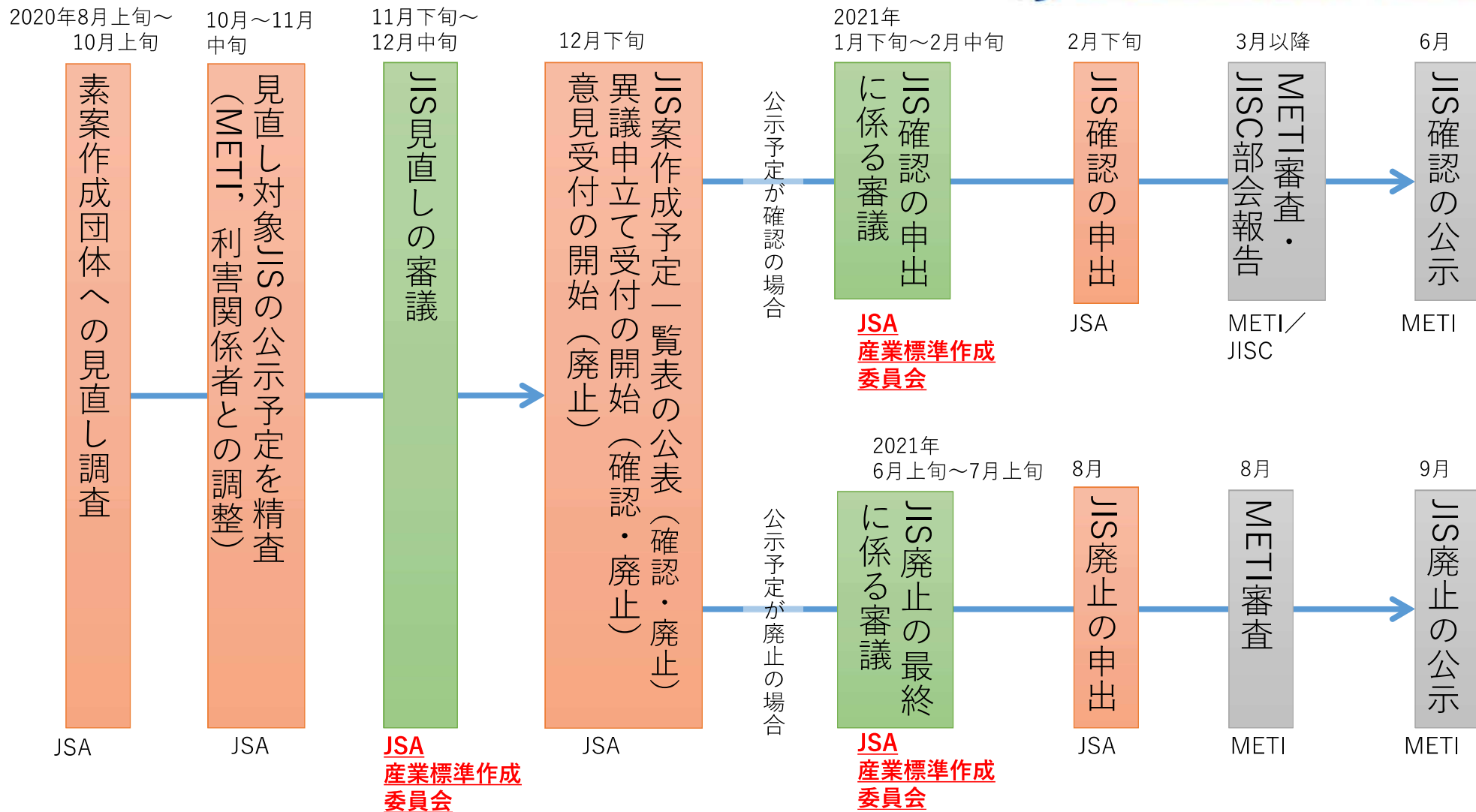
日本産業規格（以下、JIS という。）は、産業標準化法に基づき、JIS を制定又は確認若しくは改正した日から少なくとも 5 年を経過するまでに見直す必要があります。多数の JIS があることから効率的な運用のために、毎年度一括して JIS 見直しを行うこととしております。JIS の見直しの流れ及び産業標準作成委員会の審議方法は、別添 1 をご参照ください。

2021 年度に見直し期限を迎える電子分野の JIS について、当会にて関係各方面の意見を十分に調査し、別添 2 のとおり 2021 年度中に改正、確認又は廃止とするかの案を作成いたしましたので、ご審議をお願いいたします。

なお、字句等編集上の修正については、産業標準作成委員会事務局に一任いただきますようお願いいたします。また、ご承認いただいた JIS 見直しのうち、公示予定が「確認」及び「廃止」の JIS については、その内容を利害関係者に公表するために JIS 作成予定一覧表として JSA ホームページに掲載いたします。

JISの見直しに関する審議

(1) JIS見直しの流れ



(2) JIS見直しの審議について

目的： 次年度に5年見直し期限を迎えるJISについて、「改正」、「確認」又は「廃止」のいずれにするかの見直し方針を決定します。

1. 利害関係者の意見を確認するため、JSAが見直し対象のJISを抽出し、調査します。
 - ※ 見直し対象は、次年度に5年見直し期限を迎えるJISです。
 - ※ 技術的動向、対応国際規格や引用規格の改正・廃止などを背景に、JISを改正する必要があるのか、確認でよいのか、又は廃止するかなどを調査します。
2. JSAが調査結果に基づき、それぞれのJISについて「改正」、「確認」又は「廃止」のいずれにするかの案（以下、JIS見直し案という。）を理由とともに作成します。
その際には、必要に応じて、JSAが素案作成団体に事実確認を行います。
JSA内部にて、産業標準作成責任者の了承を得た後、産業標準作成委員会にお諮りします。
3. 産業標準作成委員会でJIS見直し案をご審議いただきます。
 - ※ JIS見直し案の資料については、JSAで事実確認を行っております。
 - ※ ご承認いただいたJIS見直しのうち、公示予定が「確認」及び「廃止」のJISは、JIS作成予定一覧表としてJSAホームページに掲載します。
(利害関係者に対する産業標準作成委員会への参加の機会の確保及び異議申立ての機会の確保のため)

(3) JIS確認の申出に係る審議

目的： 利害関係者の意向を適切に反映するためのプロセスを経て、主務大臣にJISの確認の申出をしてよいかどうかを決定します。

1. JIS確認の計画の公表によって、利害関係者の意向を確認した後、JSAが日本産業規格作成審議経過報告書（確認）を作成します。
 - ※ 当該報告書では、確認の申出を行う対象JIS、確認する理由、認定機関としてのプロセスの結果（JIS見直しの審議～JIS確認の計画の公表の結果）を示しております。
2. 産業標準作成委員会で日本産業規格作成審議経過報告書（確認）に基づき、ご審議いただきます。
 - ※ JIS見直しの審議の結果から変更がある場合は、JSAからその旨産業標準作成委員会にご報告いたします。
3. 産業標準作成委員会で承認されたJISは、JSAから主務大臣へJISの確認の申出を行います。

2021年度に見直し期限を迎えるJISの見直し(案)(電子分野)

別添2

規格番号	規格名称	公示予定 (確認、改正、廃止又は“－”を入力)	左記理由	対応国際規格との整合	備考	素案作成団体
C2560-2	フェライト磁心—第2部:試験方法	確認	改正に着手し改正公示となるのが再来年度以降となるため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術産業協会
C2560-3	フェライト磁心—第3部:寸法及び外形異常	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術産業協会
C2560-3-1	フェライト磁心—第3-1部:寸法及び外形—E形フェライト磁心	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術産業協会
C5270	電子機器用コンデンサ及び抵抗器—軸操作形部品の操作軸、取付ねじ及び取付孔の形状並びに推奨寸法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
C5381-331	低圧サージ防護デバイス用金属酸化物バリスタ(MOV)の試験方法	改正	改正に着手しており、来年度中に改正公示予定であるため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
C5402-12-1	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-1部:はんだ付け試験—試験12a:はんだ付け性、ぬれ(ウェットテイング)、はんだ槽法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術産業協会
C5402-12-2	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-2部:はんだ付け試験—試験12b:はんだ付け性、ぬれ(ウェットテイング)、はんだこて法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術産業協会
C5402-12-4	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-4部:はんだ付け試験—試験12d:はんだ耐熱性、はんだ槽法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術産業協会
C5402-12-5	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-5部:はんだ付け試験—試験12e:はんだ耐熱性、はんだこて法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術産業協会
C5402-22-1	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第22-1部:静電容量試験—試験22a:静電容量	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
C5402-8-2	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第8-2部:静的な力試験(固定形コネクタ)—試験8b:静的な力、軸方向	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
C5504	ホーンスピーカ	確認	規定内容の変更の必要がないため。	5: 無(提無)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般社団法人 電子情報技術産業協会
C5630-1	マイクロマシン及びMEMS—第1部:マイクロマシン及びMEMSに関する用語	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般財団法人マイクロマシンセンター

【JIS書誌情報】

規格番号及び西暦年	最新 公示		参照文書 (JSA調査結果)				対応国際規格	対応国際規格の同等性	制定年月日	最新改正日
	種類	年月日	対応国際規格	引用JIS	引用国際規格					
JIS C 2560-2:2006	確認	2016/10/20	×	×	◎	IEC 60424-1:1999;IEC 61631:2001;IEC 62044-1:2002;IEC 62044-2:2005;IEC 62044-3:2000	MOD;MOD;MOD;MOD;MOD	2006/11/20		
JIS C 2560-3:2016	制定	2016/12/20	×	◎	-		MOD;MOD;MOD;MOD	2016/12/20		
JIS C 2560-3-1:2006	確認	2016/10/20	×	-	×		MOD;MOD;MOD;MOD	2006/11/20		
JIS C 5270:2011	確認	2016/10/20	◎	-	×	IEC 60915:2006/Technical Corrigendum 1:2008	IDT	2011/08/22		
JIS C 5381-331:2006	確認	2016/10/20	×	×	×	IEC 61643-331:2003	IDT	2006/11/20		
JIS C 5402-12-1:2016	制定	2016/12/20	◎	◎	-	IEC 60512-12-1:2006	MOD	2016/12/20		
JIS C 5402-12-2:2016	制定	2016/12/20	◎	◎	-	IEC 60512-12-2:2006	MOD	2016/12/20		
JIS C 5402-12-4:2016	制定	2016/12/20	◎	◎	-	IEC 60512-12-4:2006	MOD	2016/12/20		
JIS C 5402-12-5:2016	制定	2016/12/20	◎	◎	-	IEC 60512-12-5:2006	MOD	2016/12/20		
JIS C 5402-22-1:2016	制定	2016/12/20	◎	-	-	IEC 60512-22-1:2010	IDT	2016/12/20		
JIS C 5402-8-2:2016	制定	2016/12/20	◎	◎	-	IEC 60512-8-2:2011	IDT	2016/12/20		
JIS C 5504:2016	改正	2016/11/21	-	◎	-			1954/08/18	2016/11/21	
JIS C 5630-1:2017	改正	2017/03/21	◎	-	-	IEC 62047-1:2016	MOD	2008/03/20	2017/03/21	

参照文書の記号の説明
 ◎ 当該JIS発効時の参照文書のすべてが、改廃されずに、存続している。
 × 当該JIS発効時以降、参照文書の一部及び/又は全てが、改正及び/又は廃止されている(現状が不明なもの含む)。

規格番号	規格名称	公示予定 (確認、改正、廃止又は“－”を 入力)	左記理由	対応国際規格との整合	備考	素案作成団体
C5630-6	マイクロマシン及びMEMS—第6部:薄膜材料の軸荷重疲労試験方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人マイクロマシンセンター
C5750-3-1	ディンダビリティ管理—第3-1部:適用の指針—ディンダビリティ解析手法の指針	確認	引用規格の一部は改正されており、一部は改正が予定されている。それらの動向を踏まえて検討する必要があるため。	1: IDT		無
C5877-2	偏光子試験方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	5: 無(提無)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般財団法人 光産業技術振興協会
C5914-3	光伝送用サーキュレータ—第3部:シングルモード光ファイバビッグテール形光サーキュレータ	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会
C5920-3	光伝送用パワー制御受動部品—第3部:シングルモード光ファイバビッグテール形電気制御式可変光減衰器	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会
C5948	光伝送用半導体レーザモジュールの信頼性評価方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会
C5953-1	光伝送用能動部品—性能標準—第1部:総則	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C5953-7	光伝送用能動部品—性能標準—第7部:GPON用光トランシーバ	確認	規定内容の変更の必要がないため。	5: 無(提無)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般財団法人 光産業技術振興協会
C5954-4	光伝送用能動部品—試験及び測定方法—第4部:GPON用光トランシーバ	確認	規定内容の変更の必要がないため。	5: 無(提無)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般財団法人 光産業技術振興協会
C5955-1	光伝送用能動部品—性能標準テンプレート—第1部:単心直列伝送リンク用光送・受信モジュール	確認	規定内容の変更の必要がないため。	5: 無(提無)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般財団法人 光産業技術振興協会
C5965-2-1	光ファイバコネクタ光学互換—第2-1部:シングルモード直角PC端面光ファイバ光学互換標準の指針	確認	対応国際規格の改訂が予定されており、その動向を踏まえて検討する必要があるため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C5965-2-2	光ファイバコネクタ光学互換—第2-2部:シングルモード斜めPC端面光ファイバ光学互換標準の指針	確認	対応国際規格の改訂が予定されており、その動向を踏まえて検討する必要があるため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会

【JIS書誌情報】

規格番号及び西暦年	書誌情報			参照文書 (JSA調査結果)			対応国際規格	対応国際規格の同等性	制定年月日	最新改正日
	最新公示			対応国際規格	引用JIS	引用国際規格				
	種類	年月日								
JIS C 5630-6:2011	確認	2016/10/20	◎	◎	-	IEC 62047-6:2009	IDT	2011/08/22		
JIS C 5750-3-1:2006	確認	2016/10/20	◎	x	x	IEC 60300-3-1:2003	IDT	2006/11/20		
JIS C 5877-2:2012	確認	2016/10/20	-	x	-			2012/01/20		
JIS C 5914-3:2017	制定	2017/03/21	◎	x	◎	IEC 61753-091-2:2012	MOD	2017/03/21		
JIS C 5920-3:2017	制定	2017/03/21	◎	x	◎	IEC 61753-053-2:2014	MOD	2017/03/21		
JIS C 5948:2017	改正	2017/03/21	◎	◎	-	IEC 62572-3:2016	MOD	2007/03/20	2017/03/21	
JIS C 5953-1:2016	改正	2016/05/20	◎	◎	x	IEC 62149-1:2011	IDT	2007/03/20	2016/05/20	
JIS C 5953-7:2017	制定	2017/03/21	-	x	x			2017/03/21		
JIS C 5954-4:2017	制定	2017/03/21	-	◎	-			2017/03/21		
JIS C 5955-1:2016	制定	2016/12/20	-	x	x			2016/12/20		
JIS C 5965-2-1:2011	確認	2016/10/20	◎	◎	x	IEC 61755-2-1:2006	IDT	2011/10/20		
JIS C 5965-2-2:2011	確認	2016/10/20	◎	◎	-	IEC 61755-2-2:2006	IDT	2011/10/20		

参照文書の記号の説明
◎ 当該JIS発効時の参照文書のすべてが、改廃されずに存続している。
× 当該JIS発効時以降、参照文書の一部及び/又は全てが、改正及び/又は廃止されている（現状が不明なものを含む）。

規格番号	規格名称	公示予定 (確認、改正、廃止又は“－”を 入力)	左記理由	対応国際規格との整合	備考	素案作成団体
C5965-2-4	光ファイバコネクタ光学互換標準— 第2-4部:基準接続用シングル モード直角PC端面光ファイバの接 続パラメータ	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産 業技術振興協会
C5965-2-5	光ファイバコネクタ光学互換標準— 第2-5部:基準接続用シングル モード斜めPC端面光ファイバの接 続パラメータ	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産 業技術振興協会
C5965-3-1	光ファイバコネクタ光学互換—第3 -1部:シングルモード光ファイバ用 直径2.5mm及び1.25mm円筒 形全ジルコニア直角PC端面フェ ルルール光学互換標準	確認	対応国際規格の改訂が予定されており、そ の動向を踏まえて検討する必要があるた め。	1: IDT		一般財団法人 光産 業技術振興協会
C5965-3-2	光ファイバコネクタ光学互換—第3 -2部:シングルモード光ファイバ用 直径2.5mm及び1.25mm円筒 形全ジルコニア8度斜めPC端面フェ ルルール光学互換標準	確認	対応国際規格の改訂が予定されており、そ の動向を踏まえて検討する必要があるた め。	1: IDT		一般財団法人 光産 業技術振興協会
C6101-2	テレビジョン受信機試験方法 第2 部:音声チャンネルモジュラルチャンネル の電気的測定と一般的な方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般社団法人 電子 情報技術産業協会
C6101-3	テレビジョン受信機試験方法 第3 部:副搬送波方式使用の音声多重 テレビジョン受信機の電気的測定	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般社団法人 電子 情報技術産業協会
C61191-6	プリント配線板実装—第6部: BGA 及びLGAのはんだ接合部のボイド 評価基準及び測定方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子 情報技術産業協会
C6122-10-3	光増幅器—測定方法—第10-3 部: マルチチャンネルパラメータ—ブ ローブ法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産 業技術振興協会
C6122-10-5	光増幅器—測定方法—第10-5 部: マルチチャンネルパラメータ—分布 ラマン増幅器の利得及び雑音指数	確認	改正に着手し改正公示となるのが再来年度 以降となるため。	1: IDT		一般財団法人 光産 業技術振興協会
C6122-3-1	光増幅器—測定方法—第3-1部: 雑音指数パラメータ—光スペクトラム アナライザ法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産 業技術振興協会
C6122-3-3	光増幅器—測定方法—第3-3部: 雑音指数パラメータ—信号対総AS Eパワー比	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産 業技術振興協会
C61280-1-3	光ファイバ通信サブシステム試験方 法—第1-3部: 中心波長及びスペ クトル幅測定	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産 業技術振興協会

【JIS書誌情報】

規格番号及び 西暦年	最新 公示		参照文書 (JSA調査結果)		
	種類	年月日	対応 国際 規格	引用 JIS	引用 国際 規格
JIS C 5965-2-4:2016	制定	2016/11/21	◎	×	×
JIS C 5965-2-5:2016	制定	2016/11/21	◎	×	×
JIS C 5965-3-1:2011	確認	2016/10/20	◎	◎	×
JIS C 5965-3-2:2011	確認	2016/10/20	◎	◎	×
JIS C 6101-2:1998	確認	2016/10/20	◎	×	×
JIS C 6101-3:1998	確認	2016/10/20	×	-	-
JIS C 61191-6:2011	確認	2016/10/20	◎	×	-
JIS C 6122-10-3:2012	確認	2016/10/20	◎	×	-
JIS C 6122-10-5:2016	制定	2016/05/20	◎	×	-
JIS C 6122-3-1:2011	確認	2016/10/20	◎	◎	-
JIS C 6122-3-3:2016	制定	2016/05/20	◎	◎	-
JIS C 61280-1-3:2017	改正	2017/03/21	◎	×	-

参照文書の記号の説明
◎ 当該JIS発効時の参照文書のすべてが、改廃されずに、
存続している。
× 当該JIS発効時以降、参照文書の一部及び/又は全てが、
改正及び/又は廃止されている（現状が不明なものも
含む）。

対応国際規格	対応国際規 格の同等性	制定年月日	最新改正日
IEC 61755-2-4:2015	IDT	2016/11/21	
IEC 61755-2-5:2015	IDT	2016/11/21	
IEC 61755-3-1:2006	IDT	2011/10/20	
IEC 61755-3-2:2006	IDT	2011/10/20	
IEC 60107-2:1997	MOD	1998/12/20	
IEC 60107-3:1988	MOD	1998/12/20	
IEC 61191-6:2010	IDT	2011/12/20	
IEC 61290-10-3:2002	IDT	2012/01/20	
IEC 61290-10-5:2014	IDT	2016/05/20	
IEC 61290-3-1:2003	IDT	2011/10/20	
IEC 61290-3-3:2013	IDT	2016/05/20	
IEC 61280-1-3:2010	IDT	2010/05/20	2017/03/21

規格番号	規格名称	公示予定 (確認、改正、廃止又は“－”を 入力)	左記理由	対応国際規格との整合	備考	素案作成団体
C61280-2-10	光ファイバ通信サブシステム試験方法—第2-10部:レーザ送信器の時間分解チャープ及びアルファファクタ測定	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61280-2-2	光ファイバ通信サブシステム試験方法—第2-2部:光アイバターン、光波形及び消光比測定	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-2-22	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-22部:温度サイクル試験	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-2-47	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-47部:熱衝撃試験	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-2-49	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-49部:取付け済み光ファイバコード付き光ファイバコネクタプラグの曲げ試験	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-2-50	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-50部:光ファイバクランプ強度試験—非通光左右曲げ引張り	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-2-51	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-51部:光ファイバクランプ強度試験—通光左右曲げ引張り	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-3-14	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-14部:可変光減衰器の減衰量の設定の誤差及び再現性測定	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-3-2	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-2部:シングルモード光デバイスの光損失の偏光依存性	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-3-4	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-4部:損失測定	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61300-3-47	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-47部:干渉法による直角PC端面及び斜めPC端面単心円筒形フェルールの端面形状測定	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
C61760-4	表面実装技術—第4部:感湿性部品の分類、包装、表示及び取扱い	改正	改正に着手しており、来年度中に改正公示予定であるため。	1: IDT	追補	一般社団法人 電子情報技術産業協会

【JIS書誌情報】

規格番号及び西暦年	書誌情報		参照文書 (JSA調査結果)			対応国際規格	対応国際規格の同等性	制定年月日	最新改正日	
	最新 公示	種類	年月日	対応国際規格	引用 JIS					引用国際規格
JIS C 61280-2-10:2012	確認	2016/10/20	◎	-	-	IEC 61280-2-10:2005	IDT	2012/01/20		
JIS C 61280-2-2:2017	改正	2017/03/21	◎	◎	-	IEC 61280-2-2:2012/CORRIGENDUM 1:2015	IDT	2010/05/20	2017/03/21	
JIS C 61300-2-22:2012	確認	2016/10/20	◎	x	-	IEC 61300-2-22:2007	IDT	2012/01/20		
JIS C 61300-2-47:2012	確認	2016/10/20	x	x	◎	IEC 61300-2-47:2010	MOD	2012/01/20		
JIS C 61300-2-49:2016	制定	2016/06/20	◎	x	-	IEC 61300-2-49:2007	IDT	2016/06/20		
JIS C 61300-2-50:2016	制定	2016/06/20	◎	x	-	IEC 61300-2-50:2007/TECHNICAL CORRIGENDUM 1:2015	IDT	2016/06/20		
JIS C 61300-2-51:2016	制定	2016/06/20	◎	x	-	IEC 61300-2-51:2007/TECHNICAL CORRIGENDUM 1:2015	IDT	2016/06/20		
JIS C 61300-3-14:2016	制定	2016/06/20	◎	x	-	IEC 61300-3-14:2014	IDT	2016/06/20		
JIS C 61300-3-2:2012	確認	2016/10/20	◎	-	x	IEC 61300-3-2:2009	MOD	2012/01/20		
JIS C 61300-3-4:2017	改正	2017/03/21	◎	x	-	IEC 61300-3-4:2012	IDT	2011/03/22	2017/03/21	
JIS C 61300-3-47:2016	制定	2016/12/20	◎	-	-	IEC 61300-3-47:2014	IDT	2016/12/20		
JIS C 61760-4:2016	制定	2016/12/20	x	◎	◎	IEC 61760-4:2015	IDT	2016/12/20		

参照文書の記号の説明
◎ 当該JIS発効時の参照文書のすべてが、改廃されずに、存続している。
× 当該JIS発効時以降、参照文書の一部及び/又は全てが、改正及び/又は廃止されている（現状が不明なものを含む）。

規格番号	規格名称	公示予定 (確認、改正、廃止又は“－”を 入力)	左記理由	対応国際規格との整合	備考	素案作成団体
C6185-1	オプティカルタイムドメインリフレクメータ(OTDR)―第1部:試験方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	5: 無(提無)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般財団法人 光産業技術振興協会
C6187-1	光波長計―第1部:試験方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	5: 無(提無)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般財団法人 光産業技術振興協会
C62024-2	高周波誘導部品―電気的特性及び測定方法―第2部:DC/DCコンバータ用インダクタの定格電流の決め方	確認	改正に着手し改正公示となるのが再来年度以降となるため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
C62137-1-3	表面実装技術―はんだ接合部耐久性試験方法―第1-3部:繰返し落下試験方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
C62137-1-4	表面実装技術―はんだ接合部耐久性試験方法―第1-4部:繰返し曲げ試験方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
C62137-1-5	表面実装技術―はんだ接合部耐久性試験方法―第1-5部:せん断疲労試験方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
C62246-1	リードスイッチ―第1部:品目別通則	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 日本電気制御機器工業会
C62246-1-1	リードスイッチ―第1-1部:品質評価及び試験方法	確認	改正に着手し改正公示となるのが再来年度以降となるため。	2: MOD		一般社団法人 日本電気制御機器工業会
C62813	電気・電子機器用リチウムイオンキャパシタ―電気的特性の試験方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
C6870-2	光ファイバケーブル―第2部:屋内ケーブル―品種別通則	改正	改正に着手しており、本年度中に改正公示予定であるため。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会
C6870-3	光ファイバケーブル―第3部:屋外ケーブル―品種別通則	確認	対応国際規格の改訂が予定されており、その動向を踏まえて検討する必要があるため。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会

【JIS書誌情報】

規格番号及び西暦年	書誌情報		参照文書 (JSA調査結果)		
	最新公示		対応国際規格	引用JIS	引用国際規格
	種類	年月日			
JIS C 6185-1:2017	制定	2017/03/21	-	x	x
JIS C 6187-1:2016	制定	2016/05/20	-	x	x
JIS C 62024-2:2011	確認	2016/10/20	x	x	-
JIS C 62137-1-3:2011	確認	2016/10/20	◎	x	x
JIS C 62137-1-4:2011	確認	2016/10/20	◎	x	x
JIS C 62137-1-5:2011	確認	2016/10/20	◎	x	x
JIS C 62246-1:2016	制定	2016/06/20	◎	x	-
JIS C 62246-1-1:2016	制定	2016/06/20	x	x	-
JIS C 62813:2016	制定	2016/12/20	◎	◎	-
JIS C 6870-2:2006	確認	2016/10/20	x	x	x
JIS C 6870-3:2006	確認	2016/10/20	x	x	x

参照文書の記号の説明
◎ 当該JIS発効時の参照文書のすべてが、改廃されずに、存続している。
× 当該JIS発効時以降、参照文書の一部及び/又は全てが、改正及び/又は廃止されている（現状が不明なものを含む）。

対応国際規格	対応国際規格の同等性	制定年月日	最新改正日
		2017/03/21	
		2016/05/20	
IEC 62024-2:2020	IDT	2011/08/22	
IEC 62137-1-3:2008	IDT	2011/12/20	
IEC 62137-1-4:2009	IDT	2011/12/20	
IEC 62137-1-5:2009	IDT	2011/12/20	
IEC 62246-1:2015	IDT	2016/06/20	
IEC 62246-1-1:2013	MOD	2016/06/20	
IEC 62813:2015	IDT	2016/12/20	
IEC 60794-2:2002	MOD	2006/11/20	
IEC 60794-3:2001	MOD	2006/11/20	